# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-027604

(43)Date of publication of application: 30.01.2001

(51)Int.Cl.

GO1N 21/57

(21)Application number: 11-200680

(71)Applicant:

MORITEX CORP

14.07.1999

(72)Inventor:

TOYODA MAKOTO NAKAJO KIYOKAZU

MISAWA HIROYUKI

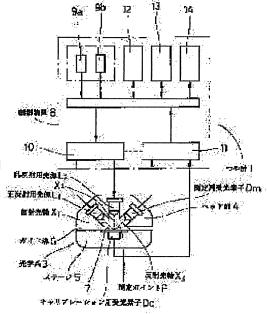
## (54) GLOSS METER

(22)Date of filing:

# (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To quantitatively measure the gloss caused by the surface properties of an object to be inspected such as hair, the skin, a fiber or cloth on the basis of the intensity of regularly reflected light and the intensity of irregularly reflected light.

SOLUTION: When a regular reflection light source L1 and an irregular reflection light source L2 are successively allowed to light, the difference between the intensities of irradiation lights of the respective light sources L1, L2 is measured by the calibration light receiving element DC arranged at a measuring point P and, next, when an object to be inspected is placed at the measuring point and the light sources L1, L2 are successively allowed to light, the intensity of regularly reflected light and the intensity of irregularly reflected light are measured by the measuring light receiving element Dm arranged on the reflected light axis X3 of the irradiation light of the regular reflection light source L1 and, since the intensities of the respective reflected lights are corrected on the basis Examelal of the difference between them, a measuring error is not almost generated.



#### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-27604 (P2001-27604A)

(43)公開日 平成13年1月30日(2001.1.30)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FI

テーマコート\*(参考)

G01N 21/57

G01N 21/57

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 6 頁)

(21)出願番号

特願平11-200680

(22)出願日

平成11年7月14日(1999.7.14)

(71)出願人 000138200

株式会社モリテックス

東京都渋谷区神宮前3丁目1番14号

(72) 発明者 豊 田 誠

埼玉県浦和市白幡四丁目19番1号 第2春 日ピル 株式会社モリテックス浦和事業所

内

(72)発明者 中條清和

埼玉県浦和市白幡四丁目19番1号 第2春 日ビル 株式会社モリテックス浦和事業所

内

(74)代理人 100084984

弁理士 澤野 勝文 (外1名)

最終頁に続く

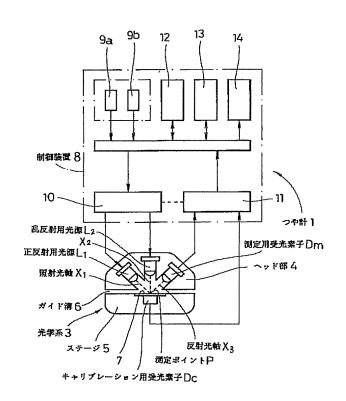
#### (54) 【発明の名称】 つや計

#### (57) 【要約】

【課題】髪, 肌, 繊維, 布などの被検体の表面性状に起因するつやを、その正反射光強度と乱反射光強度に基づいて定量的に測定できるようにする。

【解決手段】正反射用光源(Li)及び乱反射用光源

- ( $L_2$ ) を順次点灯させると、測定ポイント(P) に配されたキャリブレーション用受光素子( $D_c$ ) により各光源( $L_1$ ,  $L_2$ ) の照射光強度の違いが測定され、次に、被検体を測定ポイントにおいて各光源( $L_1$ ,  $L_2$ ) を順次点灯させると、正反射用光源( $L_1$ ) の照射光の反射光軸
- (X3) 上に配された測定用受光素子 (Dm) で、正反射光 強度及び乱反射光強度が測定される。これら各反射光強 度に基づいてつや値を算出する場合に、各反射光強度は 一つの受光素子 (Dm) で測定され、また、各反射光強度 を各照射光強度の違いに基づいて補正することとしたの で、測定誤差をほとんど生じない。



できる。

1

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 被検体を位置させる測定ポイント (P) に対して異なる角度で光を照射する正反射用光源

(L1) 及び乱反射用光源(L2) が配され、

前記測定ポイント (P) に、各光源 ( $L_1$ ,  $L_2$ ) から の照射光を受光してその照射光強度を測定するキャリブレーション用受光素子 ( $D_c$ ) が配されると共に、測定ポイント (P) に被検体を位置させたときに当該被検体で正反射される前記正反射用光源 ( $L_1$ ) の反射光軸

(X<sub>3</sub>)上に被検体からの反射光の光強度を測定する測定用受光素子(Dm)が配され、

前記各光源(L1, L2)を順次点灯させることにより前記キャリブレーション用受光素子(Dc)に光を直接照射させて夫々の照射光強度を測定し、被検体を測定ポイント(P)に位置させた状態で前記各光源(L1, L2)を順次点灯させることにより測定用受光素子(Dm)で正反射光強度及び乱反射光強度を測定し、当該正反射光強度と乱反射光強度を前記各照射光強度で補正して比較することにより反射光強度比較値を算出し、予め設定した反射光強度比較値一つや値変換テーブルを参照して反射光強度比較値に対応するつや値を読みだし、その値を表示させる制御装置(8)を備えたことを特徴とするつや計。

【請求項2】 前記測定ポイント(P)へ被検体を案内するガイド溝(6)が形成されてなる請求項1記載のつや計。

【請求項3】 前記キャリブレーション用受光素子(Dc)を配したステージ(5)が、正反射用光源

(L<sub>1</sub>), 乱反射用光源(L<sub>2</sub>)及び測定用受光素子(Dm)を配したヘッド部(4)の測定ポイント(P)に対して進退可能に配されてなる請求項1記載のつや計。

【請求項4】 前記測定ポイント (P) に位置決めされるキャリブレーション用受光素子 (Dc) が、正反射用光源 ( $L_1$ ), 乱反射用光源 ( $L_2$ )及び測定用受光素子 ( $D_m$ )を配したヘッド部 (4)に対して着脱可能に配されてなる請求項1記載のつや計。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、髪,肌,繊維,布 40 などの被検体の表面性状に起因するつやを定量的に測定するつや計に関する。

## [0002]

【従来の技術】髪の美しさを保つために様々なシャンプーや、ヘアリンス、ヘアパック、その他の頭髪用化粧品が髪の質に応じて製造・販売されており、美容院や化粧品店では、美容師や販売員が顧客の髪を見て、経験に基づき髪の質を判断し、最適なシャンプーや頭髪用化粧品を勧めたり、その使用法をアドバイスしたりしている。

【0003】髪の質は主としてつやの程度に基づいて判 50

断されるが、そのつやは表面の粗さに依存し、具体的には髪の表面に形成されるキューティクルが剥がれることなく綺麗に揃っているか否かに依存する。したがって、つやを定量的に測定することができれば、髪の質を客観的に知ることができ、顧客に対しても、より適格なアドバイスをすることができるだけでなく、その頭髪用化粧品を使用したことによる効果を客観的に確認することも

【0004】光学的には、光の反射が大きいほどつやがあると言うことができるが、光の反射には、正反射と乱反射の二種類ある。正反射は、反射面において巨視的に見て鏡面反射のような反射の法則に従う反射であり、乱反射は反射面において反射角以外の方向へ散乱する反射である。そして、本発明者の研究によれば、乱反射光強度に対する正反射光強度の比と、見た目で感じるつやとの間に相関関係があり、この点についてはつやと光沢度が極めて近似していることが判明した。

【0005】光沢度は、図6に示すような光沢度計で測定される。この光沢度計は、内面が白色に塗装された積分球51の中心に被検体を位置させる測定ポイント52が形成され、当該測定ポイント52に向かって所定の入射角度で光を照射する光源53が配され、当該光源53から照射された光が測定ポイント52で正反射されたときの反射光軸54上に正反射光強度測定用の受光素子55が配されると共に、前記測定ポイント52の垂直上方に乱反射光強度測定用の受光素子56が配されている。

【0006】これによれば、受光素子55により正反射 光強度を測定することができ、受光素子56により乱反 射光強度を測定することができるので、つやの測定に応 用することができる。この場合に、つやは、光沢度のよ うにJISに則って厳格に測定する必要もないので、例 えば積分球51を省略した簡易な構成としても、十分に つや計として使用することができる。

# [0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、光源53から照射された光の正反射光強度及び乱反射光強度を二つの受光素子55,56を用いて測定しているので、各受光素子55,56の感度の違いにより測定誤差を生じるという問題があった。

【0008】このため、正反射率と乱反射率を予め測定した基準反射板を測定ポイント52に配し、光源53からの光を基準反射板に照射させ、その反射光強度を各受光素子55,56で測定し、前記正反射率と乱反射率に基づいて各受光素子55,56の感度の違いを補正しているが、基準反射板が汚損されてしまうと正しく補正することもできない。

【0009】そこで本発明は、正反射光強度と乱反射光 強度に基づいて被検体のつやを誤差なく定量的に測定で きるようにすることを技術的課題としている。

[0010]

2

【課題を解決するための手段】この課題を解決するため に、本発明は、被検体を位置させる測定ポイントに対し て異なる角度で光を照射する正反射用光源及び乱反射用 光源が配され、前記測定ポイントに、各光源からの照射 光を受光してその照射光強度を測定するキャリブレーシ ョン用受光素子が配されると共に、測定ポイントに被検 体を位置させたときに当該被検体で正反射される前記正 反射用光源の反射光軸上に被検体からの反射光の光強度 を測定する測定用受光素子が配され、前記各光源を順次 点灯させることにより前記キャリブレーション用受光素 子に光を直接照射させて夫々の照射光強度を測定し、被 検体を測定ポイントに位置させた状態で前記各光源を順 次点灯させることにより測定用受光素子で正反射光強度 及び乱反射光強度を測定し、当該正反射光強度と乱反射 光強度を前記各照射光強度で補正して比較することによ り反射光強度比較値を算出し、予め設定した反射光強度 比較値一つや値変換テーブルを参照して反射光強度比較 値に対応するつや値を読みだし、その値を表示させる制 御装置を備えたことを特徴とする。

【0011】本発明によれば、被検体を位置させる測定ポイントに対して異なる角度から光を照射する正反射用光源及び乱反射用光源を順次点灯させると、測定ポイントに配されたキャリブレーション用受光素子により各光源の照射光強度の違いが測定され、次に被検体を測定ポイントにおいて各光源を順次点灯させると、正反射用光源の照射光の反射光軸上に配された測定用受光素子により、正反射光強度と乱反射光強度が測定される。

【0012】そして、測定用受光素子で測定された各反射光強度を、キャリブレーション用受光素子で測定された各照射光強度で補正して比較することにより反射光強度比較値が算出され、予め設定した反射光強度比較値つや値変換テーブルを参照して反射光強度比較値に対応するつや値を求め、その値を表示させる。

【0013】このとき、正反射光強度と乱反射光強度を一つの測定用受光素子で測定しているので、受光素子の感度の違いによる測定誤差を生ずることはない。また、正反射用光源と乱反射用光源の照射光強度の違いを測定ポイントに配された一つのキャリブレーション用受光素子で測定し、その測定結果に基づいて各反射光強度を補正するので、二つの光源を使用したことによる測定誤差 40を生ずることもない。

# [0014]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて具体的に説明する。図1は本発明に係るつや計の概略構成を示すブロック図、図2はつや計の外観斜視図、図3はその処理手順を示すフローシート、図4及び図5は他の実施形態を示す斜視図である。

【0015】図1及び図2に示すつや計1は細長いスティック状のグリップ2の先端側に髪等の被検体の正反射 光強度及び乱反射光強度を測定する光学系3が形成され ている。

【0016】この光学系3は、青色LEDなどの正反射用光源 $L_1$  及び乱反射用光源 $L_2$  と測定用受光素子 $D_m$  を配したヘッド部4と、キャリブレーション用受光素子 $D_m$  を配したステージ5からなり、ヘッド部4とステージ5の間には、被検体を挿し入れる幅 $1\sim2\,mm$ のガイド溝6となるギャップが形成されている。

【0017】前記正反射用光源L1及び乱反射用光源L2は、被検体を位置させる測定ポイントPに対して異なる角度から光を照射するように、夫々の照射光軸X1,X2が測定ポイントPで交差するように配され、測定用受光素子Dmは測定ポイントPに置かれた被検体表面で正反射される前記正反射用光源L1の反射光軸X3上に配されている。

【0018】なお本例では、正反射用光源 $L_1$ 及び乱反射用光源 $L_2$ がグリップ2の長手方向に対して直行する方向に沿って配されると共に、正反射用光源 $L_1$ が測定ポイントPに向かって45°に光を照射する位置に、また、乱反射用光源 $L_2$ が測定ポイントPに向かってその真上から光を照射する位置に配設されている。

【0019】また、ステージ5には、測定ポイントPの位置に、各光源 $L_1$  ,  $L_2$  からの照射光を拡散して透過させる拡散板7が配設され、その下方に、前記キャリブレーション用受光素子Dc が配されている。

【0020】グリップ2の後端側には、前記光学系3を コントロールすると共に各受光素子Dc、Dmの測定結 果に基づいてつや値を求める制御装置8が配設されてい る。この制御装置8は、メインスイッチ9a及び測定用 スイッチ9 b からスイッチ信号が出力されたときに前記 各光源 L1, L2 を順次点灯させる駆動回路 10 と、メ インスイッチ 9 a からスイッチ信号が出力されたときに キャリブレーション用受光素子Dcを作動させ、測定用 スイッチ9 b からスイッチ信号が出力されたときに測定 用受光素子Dmを作動させる受光素子切換回路11と、 各受光素子Dc, Dmで測定された光強度に基づいて所 定の手順に従いつや値を求める演算処理装置12と、反 射光強度比較値に対応するつや値を予め設定した反射光 強度比較値一つや値変換テーブルや各受光素子Dc,D mの測定結果など必要なデータを記憶する記憶装置13 と、前記演算処理装置12で求められたつや値を表示す るディスプレイ14からなる。

【0021】制御装置8における処理手順は、図3に示すように、ステップSTP1でメインスイッチ9aが押されたか否かを判断し、メインスイッチ9aが押されると処理が開始され、ステップSTP2でキャリブレーション用受光素子Dcが作動され、ステップSTP3で正反射用光源 $L_1$ 及び乱反射用光源 $L_2$ が順次点灯されて、キャリブレーション用受光素子Dcで測定された夫々の照射光強度 $S_1$ 、 $S_2$ をステップSTP4で記憶装置13の所定の記憶領域に記憶する。

6

【0022】ステップ STP5では測定用スイッチ9bが 押されたか否かを判断し、ステップ STP6ではメインスイッチ9aがオフされたか否かを判断する。そして、メインスイッチ9aがオフされたときには処理を中止し、オフされていないときにはステップ STP5に戻る。

【0023】次いで、例えば髪のつやを測定する場合は、髪を切ることなく所要本数引き出し、軽く張った状態でガイド溝6に入れて、測定用スイッチ9bをオンすると、ステップ STP5からステップ STP7に移行して測定用受光素子Dmが作動され、ステップ STP8で正反射用光源L1及び乱反射用光源L2が順次点灯されて髪からの正反射光と乱反射光が順次測定用受光素子Dmに入射され、測定用受光素子Dmで測定された正反射光強度R1及び乱反射光強度R2をステップSTP9で記憶装置13の所定の記憶領域に記憶する。

【0024】次いで、ステップ STP 10 に移行し、つや値を算出してその結果を表示させた後、ステップ STP 5 に戻る。このステップ STP 10 では、ステップ STP 9 で記憶した正反射光強度 $R_1$  及び乱反射光強度 $R_2$  を、ステップ STP 5 で記憶した夫々の照射光強度 $S_1$  , $S_2$  で補正して比較することにより、例えば、反射光強度比較値Hを、

 $H=(S_2/S_1)\cdot (R_1/R_2)$  で求める。

【0025】これによれば、各光源 $L_1$ , $L_2$  から照射される光の強度の違いが $S_2$   $/S_1$  により補正され、同一の光強度の光が照射さたときの正反射光強度と乱反射光強度の比と等しくなる。

【0026】次いで、つや値Tを反射光強度比較値Hと 正比例させて、式

 $T = \alpha H$  ( $\alpha$  は比例定数)

を反射光強度比較値一つや値変換テーブルに記憶させ、  $T=0.0\sim9.9$ までの値をとるように $\alpha$ の値を設定しておけば、つや値Tをディスプレイ装置1.4に1.0.0段階表示することができる。

【0027】このように、本例によれば、正反射用光源 L1の照射光軸X1の入射角とその反射光軸X3の反射 角が等しいので、正反射用光源L1から照射された光で 正反射光強度を測定することができ、乱反射用光源L2 の照射光軸X2の入射角と前記反射光軸X3の反射角は 40 等しくないので、乱反射用光源L2から照射された光で 乱反射光強度を測定することができる。

【0028】そして、正反射光強度と乱反射光強度を一つの測定用受光素子Dmで測定しているので、受光素子の感度の違いによる測定誤差を生ずることはない。なお、各光源 $L_1$ , $L_2$  の照射光強度を一つのキャリブレーション用受光素子D c で測定し、その測定結果に基づいて、各反射光強度を補正することとしているので、二つの光源 $L_1$ , $L_2$  を使用したことによる測定誤差を生ずることもない。

【0029】なお、正反射用光源L1, 乱反射用光源L2, 測定用受光素子Dmは、正反射用光源L1の照射光軸X1 と乱反射用光源L2の照射光軸X2が測定ポイントPで交差し、前記照射光軸X1と、測定用受光素子Dmの光軸である反射光軸X3が測定ポイントPに対して入射角・反射角の関係にあれば、その位置関係は任意である。

【0030】また、反射光強度比較値を算出する式は、上述の式に限るものではなく、乱反射光強度と正反射光強度の大小を比較し得る任意の式を採用することができ、また、数式により算出するものに限らず、反射光強度比較値とつや値を数表として記憶したものであってもよい。さらに、つや値は、ディスプレイ14に数字を用いてデジタル的に表示する場合に限らず、アナログ的に表示する場合であってもよい。

【0031】上述の説明では、各光源 L1, L2 及び測定用受光素子Dmを配したヘッド部4と、キャリブレーション用受光素子Dcを配したステージ5をグリップ2の先端に固定して設けた場合について説明したが、本発明はこれに限らず、例えば、図4に示すように、ヘッド部4に対してステージ5を開閉可能にしたクリップ型に形成し、ヘッド部4とステージ5で被検体を挟持できるようにしてもよく、この場合、ステージ5を開閉することによりキャリブレーション用受光素子Dcが測定ポイントPに対して進退されるように形成されている。

【0032】また、図5に示すように、前記ステージ5をヘッド部4に対して着脱可能に形成すれば、ガイド溝6に挿入し得る薄い被検体についてはステージ5を装着した状態で測定し、ガイド溝6に挿入することができない被検体についてはステージ5を外しヘッド部4を直接被検体に押し当てて測定できる。この場合において、ステージ5をヘッド部4に装着したときに、ヘッド部4側に形成した電極(図示せず)とステージ5に形成した電極21を接触させるようにすれば、ステージ5を着脱可能としても、当該ステージ5に配されたキャリブレーション用受光素子Dcと制御装置8とを接続するコード類が不要となる。

【0033】さらに、表面性状に起因するつやを定量的に測定する被検体としては髪に限らず、肌、繊維、布など任意のものを測定することができる。

#### [0034]

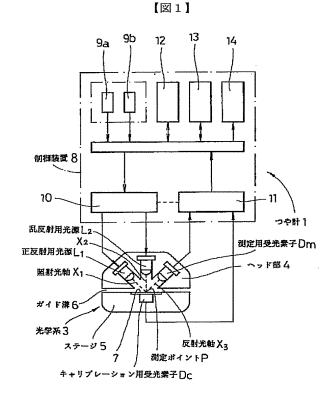
【発明の効果】以上述べたように、本発明によれば、正 反射用光源と乱反射用光源から照射される夫々の光の正 反射光強度と乱反射光強度を測定する際に、各反射光強 度を一つの測定用受光素子で測定しているので、受光素子の感度の違いによる測定誤差を生ずることがなく、また、各光源の照射光強度を一つのキャリブレーション用 受光素子で測定し、その測定結果に基づき各反射光強度を補正するので、二つの光源を使用したことによる測定 誤差を生ずることがなく、これら各測定値に基づいて被

検体のつやを誤差なく定量的に測定することができるという大変優れた効果を奏する。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係るつや計の概略構成を示すブロック図。

- 【図2】つや計の外観斜視図。
- 【図3】その処理手順を示すフローシート。
- 【図4】他の実施形態を示す斜視図。
- 【図5】他の実施形態を示す斜視図。
- 【図6】光沢度計を示す説明図。



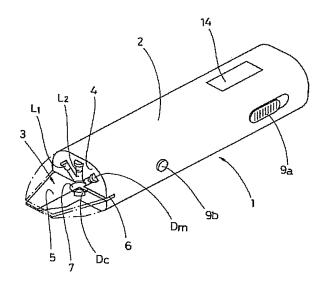
#### 【符号の説明】

1・・・つや計3・・・光学系4・・・ヘッド部5・・・ステージP・・・測定ポイント6・・・ガイド溝L1・・正反射用光源L2・・乱反射用光源

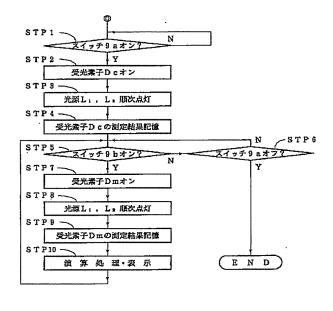
X1 , X2 ・・照射光軸X3 ・・・・反射光軸Dm・・測定用受光素子Dc・・キャリブレーショ

ン用受光素子 8・・・制御装置

# 【図2】

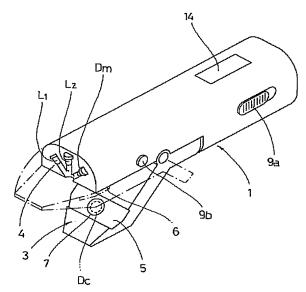


【図3】

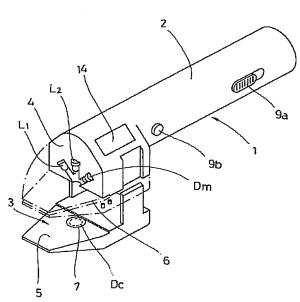




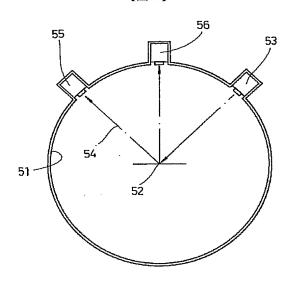
1



【図5】



【図6】



フロントページの続き

# (72) 発明者 三澤宏至

埼玉県浦和市白幡四丁目19番1号 第2春 日ビル 株式会社モリテックス浦和事業所 内

F ターム(参考) 2G059 AA02 EE02 FF08 GG03 MM10 MM12 PP04